Mikroskopische Bestimmung thermischer und struktureller Eigenschaften dünner Schichten durch modifizierte Raster-Sonden-Verfahren

Motivation

Analytik dünner und ultra- dünner Schichten

Vorgehen

Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit dünner Schichten. Ziel des geplanten Vorhabens ist die Entwicklung, der Bau und die Erprobung eines Zusatzmoduls (Add-on Modul) für Raster-Sonden-Mikroskope (RSM) zur thermischen Charakterisierung dünner Schichten und nanostrukturierter Materialen wie sie beispielsweise für Thermogeneratoren benötigt werden. Im Rahmen des beantragten Vorhabens soll das Modul in Verbindung mit bereits etablierten Mess- und Charakterisierungsmethoden eingesetzt werden.

Eckdaten

Kurztitel

3ω-Microscopy

Forschungsschwerpunkt

Sustainable Production, Energy Technologies and Smart Materials

Laufzeit

01.09.2012 - 31.08.2015

Fördergeber

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Projektleitung

Prof. Dr.-Ing. Günther Benstetter